

Journée Thématique du réseau R&D semi-conducteurs - Effets des irradiations dans les détecteurs semi-conducteurs

ID de Contribution: 15

Type: Non spécifié

Domage des ions lourds sur détecteurs Silicium

jeudi 16 juin 2016 14:00 (30 minutes)

Orateur: M. LE NEINDRE, Nicolas (LPC)